## §9.2 正态总体的参数检验

关于 $\sigma^2$ 的检验( $\mu$  未知)

 $(1)\sigma^2$ 的双边检验( $\mu$  未知)

设  $X \sim N$  ( $\mu$ ,  $\sigma^2$ ),  $\mu$  未知, 需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2: H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 $\alpha$ 与样本值 $(x_1, x_2, ..., x_n)$ 构造统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2: H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

#### 拒绝域的推导

#### 形式:

若 $\sigma^2=\sigma_0^2$ 成立,则样本方差  $S^2$ 不能偏离 $\sigma_0^2$ 太多,即  $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$  不能非常大或者非常小  $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$  非常大时,说明样本数据不支持原假设  $\sigma^2=\sigma_0^2$ ,而是支持被择假设  $\sigma^2\neq\sigma_0^2$ 

 $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$  非常小时,说明样本数据不支持原假设

 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ , 而是支持被择假设  $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2: H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

形式为:

显著性水平为 $\alpha$  , 即  $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$  非常大或者非常小的标准为:  $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$  非常大或者非常小到其发生的

概率只有 $\alpha$  (0.05或0.01)

因为统计量 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P_{H_0} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ if } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$$

$$= \alpha$$

### 故拒绝域

$$\left\{ S^{2} \mid \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \leq \chi^{2}_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \not \exists \chi \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \geq \chi^{2}_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$$

#### $(1)\sigma^2$ 的右边检验( $\mu$ 未知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2: H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \ge \chi^{2}_{1-\alpha}(n-1)$$

### $(1)\sigma^2$ 的左边检验( $\mu$ 未知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 : H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le \chi^2_{\alpha}(n-1)$$

# $\sigma^2$ 的检验 ( $\mu$ 未知)

原假设 <i>H</i> <sub>0</sub>	备择假设 <i>H</i> <sub>1</sub>	检验统计量及其在 $H_0$ 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \le \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \ge \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 \ge \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\frac{\sigma^2 \leq \sigma_0^2}{\sigma^2 = \sigma_0^2}$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	(μ未知)	$\chi^2 \le \chi_\alpha^2 (n-1)$

#### $\rightarrow$ 关于 $\sigma^2$ 的检验( $\mu$ 已知)

### $(1)\sigma^2$ 的双边检验( $\mu$ 已知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu$ 已知,需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 : H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 $\alpha$ 与样本值 $(x_1,x_2,...,x_n)$ 构造统计量

$$\chi^{2} = \frac{1}{\sigma_{0}^{2}} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \mu)^{2} = \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_{i} - \mu}{\sigma_{0}} \right)^{2} \sim \chi^{2}(n)$$

#### 故拒绝域

$$\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \quad \text{Res} \quad \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$$

### $(1)\sigma^2$ 的右边检验( $\mu$ 已知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2: H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \ge \chi^2_{1-\alpha}(n)$$

### $(1)\sigma^2$ 的左边检验( $\mu$ 已知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 : H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{\alpha}(n)$$

# $\sigma^2$ 的检验( $\mu$ 已知)

原假设 <i>H</i> <sub>0</sub>	备择假设 <i>H</i> <sub>1</sub>	检验统计量及其在 H <sub>0</sub> 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$		$\chi^{2} \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2}(n)$ 或 $\chi^{2} \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2}(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \le \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{x_{i} - \mu}{\sigma_{0}} \right)^{2}$ $\sim \chi^{2}(n)$	$\chi^{2} \geq \chi^{2}_{1-\alpha}(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	( µ 已知)	$\chi^2 \le \chi_\alpha^2(n)$

例1: 某厂生产螺钉,生产一直比较稳定,长期以来,螺钉的直径服从方差为 σ²=0.0002(cm²)的正态分布。今从产品中随机抽取10只进行测量,得螺钉直径的数据(单位: cm)如下:

1.19 1.21 1.21 1.18 1.17

1.20 1.20 1.17 1.19 1.18

问:  $(\alpha = 0.05)$ 

- (1)是否可以认为螺钉直径的方差为0.0002
- (2)是否可以认为螺钉直径的方差大于0.0002

(1) µ 未知

$$H_0: \sigma^2=0.0002$$
;  $H_1: \sigma^2\neq 0.0002$ 

拒绝域: 
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$
 或  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 

**查表知**: 
$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{\frac{0.05}{2}}(10-1) = 2.7$$
 
$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{1-\frac{0.05}{2}}(10-1) = 19.0$$

故拒绝域: 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \in (0, 2.7) \cup (19.0, \infty)$$

而由观测值知:
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 = 0.00022$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 10$$
 故接受

(2) # 未知

$$H_0: \sigma^2=0.0002; H_1: \sigma^2>0.0002$$

拒绝域: 
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$$

**查表知**: 
$$\chi^2_{1-\alpha}(n-1) = \chi^2_{1-0.05}(10-1) = 16.9$$

故拒绝域: 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \in (16.9, \infty)$$

而由观测值知:
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = 0.00022$$

$$\chi^{2} = \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} = 10$$

故接受

例2某汽车配件厂在新工艺下对加工好的 25个活塞的直径进行测量,得样本方差s<sup>2</sup>=0.00066. 已知老工艺生产的活塞直径的方差为0.00040. 问 改革后活塞直径的方差是否大于改革前?

解 设测量值  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$   $\sigma^2 = 0.00040$ 

需考察改革后活塞直径的方差是否大于改革前 的方差?故待检验假设可设为:

 $H_0: \sigma^2 = 0.00040$ ;  $H_1: \sigma^2 > 0.00040$ .

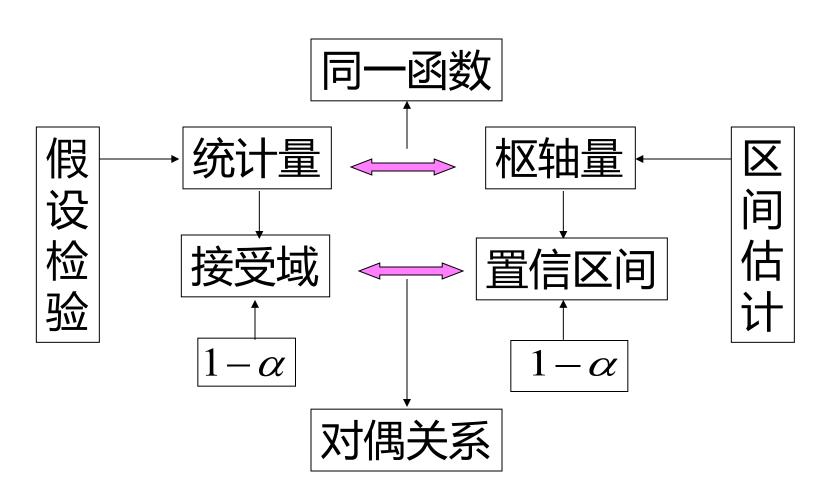
取统计量 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域 : 
$$\chi^2 \ge \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{1-0.05}^2(24) = 36.415$$

$$\mathfrak{M} \quad \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(25-1)\times 0.00066}{0.00040} = 39.6 > 36.415$$

落在拒绝域内, 故拒绝 $H_0$ . 即改革后的方差显著大于改革前的方差.

## ● 假设检验与区间估计的联系



例5 新设计的某种化学天平,其测量的误差服从正态分布,现要求 99.7% 的测量误差不超过 0.1 mg, 即要求  $3\sigma \le 0.1$ 。现拿它与标准天平相比, 得10个误差数据,其样本方差 $s^2 = 0.0009$ . 试问在  $\alpha = 0.05$ 的水平上能否认为满足设计要求?

现要求 99.7% 的测量误差不超过

0.1mg, 即要求  $3\sigma \le 0.1$ 。

注: 99.7% 的测量误差不超过 0.1mg,

$$P\{\mid X - \mu \mid < 0.1\} = 99.7\%$$

$$P\{\mid X - \mu \mid > 0.1\} = 0.3\%$$

$$P\left\{ \left| \begin{array}{c} X - \mu \\ \overline{\sigma} \end{array} \right| > \frac{0.1}{\sigma} \right\} = 0.3\%$$

$$P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} < -\frac{0.1}{\sigma} \cancel{\mathbb{R}} \frac{X-\mu}{\sigma} > \frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.3\%$$

$$P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}<-\frac{0.1}{\sigma}\right\}=0.15\%=0.0015$$

$$-\frac{0.1}{\sigma} = z_{0.0015} = -2.97 \approx -3$$

$$3\sigma \leq 0.1$$

解一  $H_0: \sigma \le 1/30$  ;  $H_1: \sigma \ge 1/30$ 

 $\mu$ 未知,故选检验统计量  $\chi^2 = \frac{9S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(9)$ 

拒绝域:
$$\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} > \chi^2_{1-0.05}(9) = 16.919$$

现 
$$\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} = 7.29 < 16.919$$
 落在拒绝域外

故接受原假设, 即认为满足设计要求.

## $\sigma^2$ 的单侧置信区间为

$$H_0$$
中, $\sigma_0^2 = \frac{1}{900} = 0.0011 < 0.0024 则 $H_0$ 成立$ 

从而接受原假设, 即认为满足设计要求.

#### ● 样本容量的选取

虽然当样本容量 n 固定时,我们不能同时控制犯两类错误的概率,但可以适当选取 n 的值,使犯取伪错误的概率  $\beta$  控制在预先给定的限度内.